

ที่ สทศ.๐๐๐๑/ว.๓๗๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)  
๒. กำหนดการทดสอบ TEC-W ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีพันธกิจในการดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการสอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงาน ให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ สทศ. จึงได้พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเทียบเคียงระดับสากล และผ่านการนำร่องใช้มาแล้วกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และระดับอาชีวศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนและนักศึกษา จำนวน ๖๓ แห่ง

ในการนี้ สทศ. ได้เปิดบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ สทศ. จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจพิจารณาเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบ และการเข้ารับการทดสอบผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.niets.or.th/th/catalog/view/๔๐๓๖> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๗ ๓๘๐๐ ต่อ ๖๐๐๒, ๖๐๐๖ และ ๖๐๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลโครงการดังกล่าวด้วย  
จกขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ)

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



กลุ่มงานนวัตกรรมและบริการการวัดและประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๑๗ ๓๘๐๐ ต่อ ๖๐๐๒, ๖๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๙๖

## ความเป็นมา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานกลาง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดช่วงชีวิต โดยเฉพาะช่วงวัยแรงงานให้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สทศ. จึงได้พัฒนาเครื่องมือวัดการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W) ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ผ่านการหาคุณภาพและเทียบเคียงแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และผ่านการทดสอบกับมหาวิทยาลัยภาครัฐ เอกชน และระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 63 แห่งทั่วประเทศ และได้ดำเนินการให้บริการทดสอบด้วยระบบดิจิทัลแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงบุคคลทั่วไป

## วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- 1 เพื่อวัดทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
- 2 เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน
- 3 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ



Scan QR Code !!  
ข้อมูลการสอบ TEC-W

# TEC-W

Test of English Communication in the Workplace



ลงทะเบียนและสมัครสอบ



นักศึกษา 300 บาท  
บุคคลทั่วไป 600 บาท  
ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของ  
ธนาคารกรุงไทย

[www.niets.or.th](http://www.niets.or.th)

สอบถามรายละเอียด 02-217-3800



Scan QR Code !!  
ทดลองสอบด้วยระบบดิจิทัล

# องค์ประกอบ ข้อสอบ TEC-W



## จุดเด่น TEC-W

- ข้อสอบมีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) เชิงเนื้อหา (Content Validity) และร่วมสมัย (Concurrent Validity)
- ข้อสอบมีความเชื่อมั่น (Reliability) มีความคงเส้นคงวาของคะแนนในการวัดแต่ละครั้ง
- ข้อสอบมีความเป็นปรนัย (Objectivity)
- ข้อสอบมีความเสมือนจริง (Practically)
- ข้อสอบ TEC-W ไม่ใช่ความรู้เรื่องไวยากรณ์ หรือคำศัพท์เท่านั้น แต่ต้องประยุกต์องค์ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการทำงานได้

## กำหนดการทดสอบ

ครั้งที่	เวลาทดสอบ
1/2566	เวลา 14.00 – 15.30 น.
2/2566	เวลา 10.00 – 11.30 น.
3/2566	เวลา 14.00 – 15.30 น.
4/2566	เวลา 10.00 – 11.30 น.

## วันสอบ

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565  
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566  
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566  
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566



## วันประกาศผลการทดสอบ

ครั้งที่	ประกาศผลสอบ
1/2566	11 มกราคม 2566
2/2566	23 มีนาคม 2566
3/2566	8 กรกฎาคม 2566
4/2566	22 กันยายน 2566



กรณีศึกษาสถานศึกษา/หน่วยงานใดมีความสนใจและมีความพร้อมในการจัดการทดสอบ สกศ. จะประเมินความพร้อมและเปิดเป็นสนามสอบ



กำหนดการทดสอบ TEC-W ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กิจกรรม \ ครั้งการสอบ	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอน	๑ พฤศจิกายน - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ชำระเงิน	๑ พฤศจิกายน - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๑ มกราคม - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ กรกฎาคม - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
กำหนดการสอบ	๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.	๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
ประกาศผลสอบ	๑๑ มกราคม ๒๕๖๖	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



กำหนดการทดสอบ TEC-W ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เฉพาะสนามสอบ สทศ.)

กิจกรรม \ ๕ ครั้งการสอบ	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ลงทะเบียนรับสมัครสอบ ตามขั้นตอน	๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ชำระเงิน	๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖	๑ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
กำหนดการสอบ	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.)	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.)	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.)	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.)
ประกาศผลสอบ	๒๖ เมษายน ๒๕๖๖	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม